

## Raster-Elektronenmikroskopie

- Modernes Raster-Elektronenmikroskop
- Sehr hohe Vergrößerungen möglich
- Erfahrene Operatoren
- Topographie- und Elementkontras

### Nutzungsmöglichkeiten

#### Dokumentationsaufgaben

Bildauflösung nach Kundenvorgabe. Klar definierte Dokumentationsaufgaben, z.B. für feine Pulver, Elektronikbauteile oder Oberflächen.

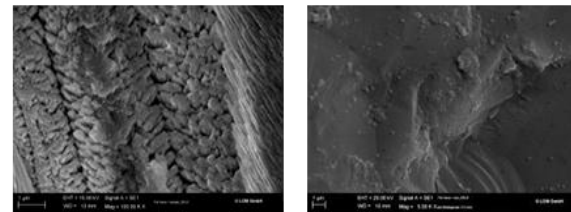
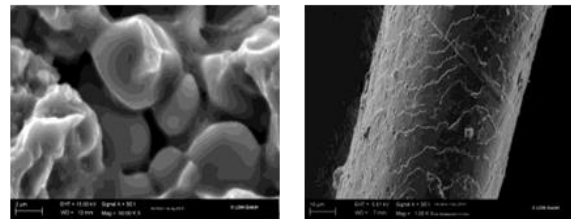
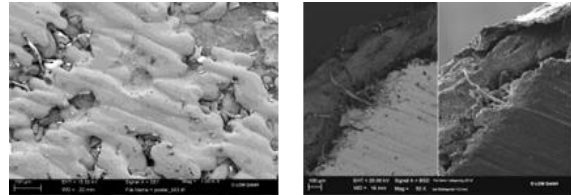
#### Engineering

Untersuchungen von Bruchflächen und Oberflächen mit komplexen Fragestellungen. Rückstandsanalysen, Charakterisierungen, etc.

#### Vermietung

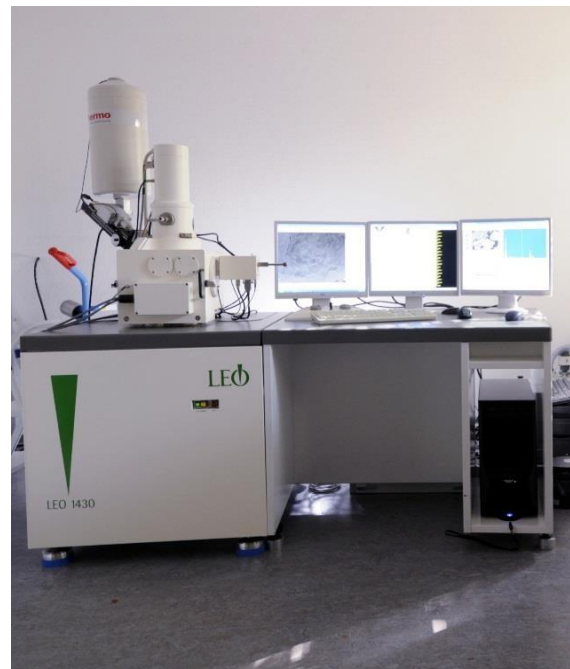
Unser REM ist jederzeit problemlos zugänglich. Informieren Sie sich! Wir machen Ihnen ein Angebot für die Vermietung inkl. Instruktion Ihrer Mitarbeiter.

**Ausserdem bieten wir Grundausbildungen und Schulungen für Ihr Personal.**



### Technische Daten:

- Auflösung 3.5 nm
- Vergrößerungen 15:1 bis 300'000:1
- BSE (Rückstreuielektronen) Detektor
- Bildauflösung max. 3072 x 2304
- Vakuumkammer 300 x 265 x 190 mm
- 5 Achsen Steuerung und Kippwinkel bis 90°
- Tischbelastung bis 2 kg



### Kontakt

LOM GmbH  
Bürerfeld 2, 9245 Oberbüren

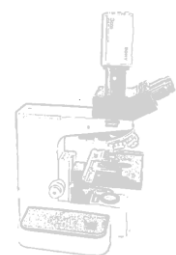
[info@lom.swiss](mailto:info@lom.swiss)

Tel. 071 950 05 75

Fax. 071 950 08 34



LinkedIn



## Energiedispersive Röntgenanalyse

- Langjährige Erfahrung und umfangreiches Archiv an Standards
- Fensterloser und mit Flüssigstickstoff gekühlter Detektor für leichte Elemente
- Analysenflächen vom Mikro- bis Millimeter Bereich

### Punkt- und Flächenanalysen

#### PMI

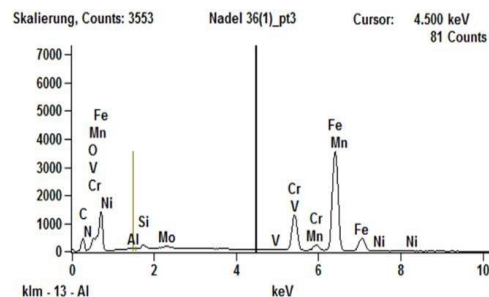
Kostengünstige und schnelle Verwechslungsprüfung. Je nach Werkstoff ca. CHF 125.- pro Probe. Auch an kleinen Spänen und „zerstörungsfrei“ (bitte anfragen).

#### Analysen mit Bilddokumentation der Messpunkte

Es kann bei praktisch beliebigen Vergrößerungen gemessen werden und die Resultate können einzeln für jeden Punkt ausgewertet werden.

#### Vermietung

Unser EDX ist jederzeit problemlos zugänglich. Informieren Sie sich! Wir machen Ihnen ein Angebot für die Vermietung inkl. Instruktion Ihrer Mitarbeiter.



Gew.-%

	Ni-K	O-K	Al-K	Si-K	V-K	Cr-K	Mn-K	Fe-K	Ni-K	Mo-L
Nadel 36(1)_pt1	5.04	0.00	0.25	0.84	0.00	15.81	0.79	75.06	0.26	0.95
Nadel 36(1)_pt2	6.56	0.00		0.67	0.14	15.58	0.48	75.44	0.06	1.07
Nadel 36(1)_pt3	6.07	4.29	0.14	0.76	0.00	15.31	0.61	71.59	0.19	0.93

### Komplexere Messaufgaben

#### Mappings

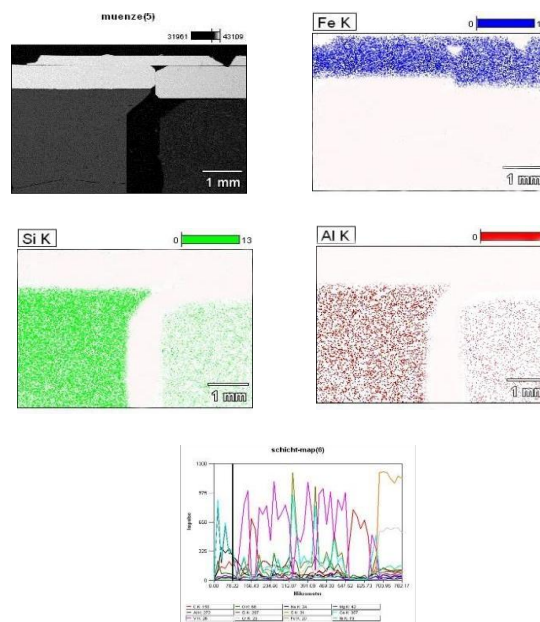
Bei einem Mapping wird einer bestimmten Zusammensetzung auf einem Bild eine Farbe zugeordnet (möglich für einzelne Elemente oder Element-Kombinationen).

#### Line Scans

Bei einem Line Scan wird die Zusammensetzung entlang einer Linie in einem Bild ausgewertet.

#### Oberflächenanalytik

Durch langjährige Erfahrung kennen wir die Möglichkeiten und Grenzen bei der Analyse von sehr dünnen Schichten und Ablagerungen.



### Kontakt

LOM GmbH  
Bürerfeld 2, 9245 Oberbüren  
[info@lom.swiss](mailto:info@lom.swiss)

Tel. 071 950 05 75  
Fax. 071 950 08 34

